

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut • Merianstraße 28 • D-63069 Offenbach

STMicroelectronics 190, Avenue Celestine Coq Z.I. 13106 Rousset CEDEX **FRANCE**

Offenbach, 2007-11-13

Your ref. Vincent ONDE Your letter 2007-06-15 Our ref. - please indicate 5008057-9999-0001/91436 FG23/Scb

Contact

Mr. Schildbach

Tel

(+49) (69) 83 06-524 (+49) (69) 83 06-606 joachim.schidlbach@vde.com

Dear Sirs,

Translation: In any case the German version shall prevail

Prüfbericht zur Information des Auftraggebers Test Report for the Information of the applicant

Produkt / Product Component for washing machines and dishwashers Typ / Type Microcontr.for Home Appl. Autom.Controls

Dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Teilen von Normen festzustellen.

This test report contains the result of a single investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards resp. parts of standards.

Der Prüfbericht berechtigt nicht zur Benutzung eines Prüfzeichens des VDE und des Zeichens "GS=geprüfte Sicherheit" und erstreckt sich nicht auf alle für das geprüfte Erzeugnis geltenden VDE-Bestimmungen.

The test report does not entitle to use a VDE Certification mark and the "GS = geprüfte Sicherheit (tested safety)" and does not refer to all VDE specifications applicable for the tested product.

Dieser Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut einschließlich dieser Vorbemerkung und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

This test report may only be passed to a third party in its complete wording including this preamble and the date of issue.

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.



and consumer products.

Notified Body according to the EMC directive for the electromagnetic compatibility (EMC) of appliances. Accredited by DAR accreditation bodies according to DIN EN ISO/IEC 17025, DIN EN 45011 and

Accredited by: IEC – International Electrotechnical Commission – IECEE/CB, IECQ and CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization – CCA, HAR, ENEC.



Page 2 - 09.11.2007

Our reference

5008057-9999-0001/91436

FG23/Scb

Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts.

Any publication or reproduction requires the prior written approval of the VDE Testing and Certification Institute.

Beschreibung 1 Description

Gegenstand:

SW-Module zum Aufbau einer Selbstdiagnose-Library für STM32-

Micro-Controller-Familie

Hersteller:

STMicroelectronics, 190, Avenue Celestine Coq,

Z.I. 13106 Rousset CEDEX, FRANCE

Тур:

| stm32f10x STLcpurunIAR.s | Rev. 1.0 |
|-----------------------------|----------|
| stm32f10x_STLcpurunKEIL.s | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLcpustartIAR.s | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLcpustartKEIL.s | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLclockrun.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLclockstart.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLcrc16.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLcrc16Run.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLcrc32.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLcrc32Run.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLFlashRun.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLtranspRamMc.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLtranspRamMx.c | Rev. 1.0 |
| | |

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.





Page 3 - 09.11.2007

Our reference

5008057-9999-0001/91436

FG23/Scb

Object:

SW-Modules to setup a self diagnostic library for STM32 micro

controller family

Manufacturer:

STMicroelectronics, 190, Avenue Celestine Coq,

Z.I. 13106 Rousset CEDEX, FRANCE

Type:

| stm32f10x STLcpurunIAR.s | Rev. 1.0 |
|-----------------------------|----------|
| stm32f10x STLcpurunKEIL.s | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLcpustartIAR.s | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLcpustartKEIL.s | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLclockrun.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLclockstart.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLcrc16.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLcrc16Run.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLcrc32.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLcrc32Run.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLFlashRun.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x STLtranspRamMc.c | Rev. 1.0 |
| stm32f10x_STLtranspRamMx.c | Rev. 1.0 |
| | |

Prüfbestimmungen II **Test Specifications**

IEC 60335-1:2001, modifiziert + Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 + A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 (A2):2006;

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006

IEC 60335-1:2001, modified + Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 + A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 (A2):2006;

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006



Notified Body according to the Equipment and Product Safety Act (GPSG) for technical work equipment and consumer products.

Notified Body according to the EMC directive for the electromagnetic compatibility (EMC) of appliances. Accredited by DAR accreditation bodies according to DIN EN ISO/IEC 17025, DIN EN 45011 and 45012.



Page 4 - 09.11.2007

Our reference

5008057-9999-0001/91436

FG23/Scb

Prüfungen Enstprechend Anhang R Tabelle H11.12.7 Ш Tests According Appendix R Table H11.12.7

Die zur Prüfung vorgelegten SW-Module für microcontrollerinterne Selbstdiagnose wurden hinsichtlich ihrer Fehlerdiagnose geprüft.

The shown SW modules for micro controller internal self diagnostics had been tested for failure detection.

Die Module sind zur Einbindung in eine übergeordnetes Selbstdiagnoseprogramm vorgesehen, welches vom Hersteller der Steuerung zur Prüfung vorzulegen ist. The modules are intented to be included in a supervisory self diagnostic program which has to be presented for approval by the manufacturer of the electronic control.

Die geprüften Module wurden zur Referenz beim VDE hinterlegt. The tested modules are deposited at the VDE as reference files.

Die Module können zur Selbstüberprüfung nach Tabelle H11.12.7 des Anhang R der Norm EN/IEC 60335-1 benutzt werden (siehe Anhang 1).

The modules can be used for self tests according table H11.12.7 of appendix R of the standart EN/IEC 60335-1 (see also appendix 1).

IV Ergebnis Result

Die geprüften Module erfüllen die Anforderungen gemäß der unter II genannten Prüfbestimmungen. Die Einbindung der Module ist in der jeweiligen Applikation zu prüfen.

The tested modules fulfil the requirements according the test specifications refered in chapter II. The implementation of the modules has to be tested in each application.



Notified Body according to the EMC directive for the electromagnetic compatibility (EMC) of appliances. Accredited by DAR accreditation bodies according to DIN EN ISO/IEC 17025, DIN EN 45011 and 45012.

Accredited by: IEC – International Electrotechnical Commission – IECEE/CB, IECQ and CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization – CCA, HAR, ENEC.



Page 5 - 09.11.2007

Our reference

5008057-9999-0001/91436

FG23/Scb

D. Seall

Mit freundlichen Grüßen With best regards

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Test and Certification Institute

Fachgebiet FG2

Manfred Bausch

Christoph Türk

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Testing and Certification Institute Institut d'Essais et de Certification Merianstrasse 28 D-63069 Offenbach http://www.vde.com

Telefon +49 (0) 69 83 06-0 Telefax +49 (0) 69 83 06-555 e-mail vde-institut@vde.com

Notified Body according to the Equipment and Product Safety Act (GPSG) for technical work equipment and consumer products.

Notified Body according to the EMC directive for the electromagnetic compatibility (EMC) of appliances. Accredited by DAR accreditation bodies according to DIN EN ISO/IEC 17025, DIN EN 45011 and 45012.

AGUTZ.

Accredited by: IEC – International Electrotechnical Commission – IECEE/CB, IECQ and CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization – CCA, HAR, ENEC.



Page 6 - 09.11.2007

Our reference

5008057-9999-0001/91436 FG23/Scb

Anhang 1

| Datei-Name des Modules | Rev. | Selbstdiagnose nach Anhang R Tabelle H11.12.7 |
|-----------------------------|------|---|
| stm32f10x STLcpurunIAR.s | 1.0 | 1.1 CPU-Register und 1.3 Programmzähler |
| stm32f10x STLcpurunKEIL.s | 1.0 | 1.1 CPU-Register und 1.3 Programmzähler |
| stm32f10x STLcpustartIAR.s | 1.0 | 1.1 CPU-Register und 1.3 Programmzähler |
| stm32f10x STLcpustartKEIL.s | 1.0 | 1.1 CPU-Register und 1.3 Programmzähler |
| stm32f10x STLclockrun.c | 1.0 | 3. Clock |
| stm32f10x STLclockstart.c | 1.0 | 3. Clock |
| stm32f10x STLcrc16.c | 1.0 | 4.1 Unveränderlicher Speicher |
| stm32f10x STLcrc16Run.c | 1.0 | 4.1 Unveränderlicher Speicher |
| stm32f10x STLcrc32.c | 1.0 | 4.1 Unveränderlicher Speicher |
| stm32f10x STLcrc32Run.c | 1.0 | 4.1 Unveränderlicher Speicher |
| stm32f10x STLFlashRun.c | 1.0 | 4.1 Unveränderlicher Speicher |
| stm32f10x STLfullRamMc.c | 1.0 | 4.2 Veränderlicher Speicher |
| stm32f10x STLtranspRamMc.c | 1.0 | 4.2 Veränderlicher Speicher |
| stm32f10x_STLtranspRamMx.c | | 4.2 Veränderlicher Speicher |

Appendix 1

| file name of module | Rev. | Self diagnostics according appendix R table H11.12.7 |
|-----------------------------|------|--|
| stm32f10x STLcpurunIAR.s | 1.0 | 1.1 CPU registers und 1.3 program counter |
| stm32f10x STLcpurunKEIL.s | 1.0 | 1.1 CPU registers und 1.3 program counter |
| stm32f10x STLcpustartIAR.s | 1.0 | 1.1 CPU registers und 1.3 program counter |
| stm32f10x_STLcpustartKEIL.s | 1.0 | 1.1 CPU registers und 1.3 program counter |
| stm32f10x STLclockrun.c | 1.0 | 3. Clock |
| stm32f10x STLclockstart.c | 1.0 | 3. Clock |
| stm32f10x STLcrc16.c | 1.0 | 4.1 invariable memory |
| stm32f10x STLcrc16Run.c | 1.0 | 4.1 invariable memory |
| stm32f10x STLcrc32.c | 1.0 | 4.1 invariable memory |
| stm32f10x STLcrc32Run.c | 1.0 | 4.1 invariable memory |
| stm32f10x STLFlashRun.c | 1.0 | 4.1 invariable memory |
| stm32f10x STLfullRamMc.c | 1.0 | 4.2 variable memory |
| stm32f10x_STLtranspRamMc.c | 1.0 | 4.2 variable memory |
| stm32f10x STLtranspRamMx.c | 1.0 | 4.2 variable memory |

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

